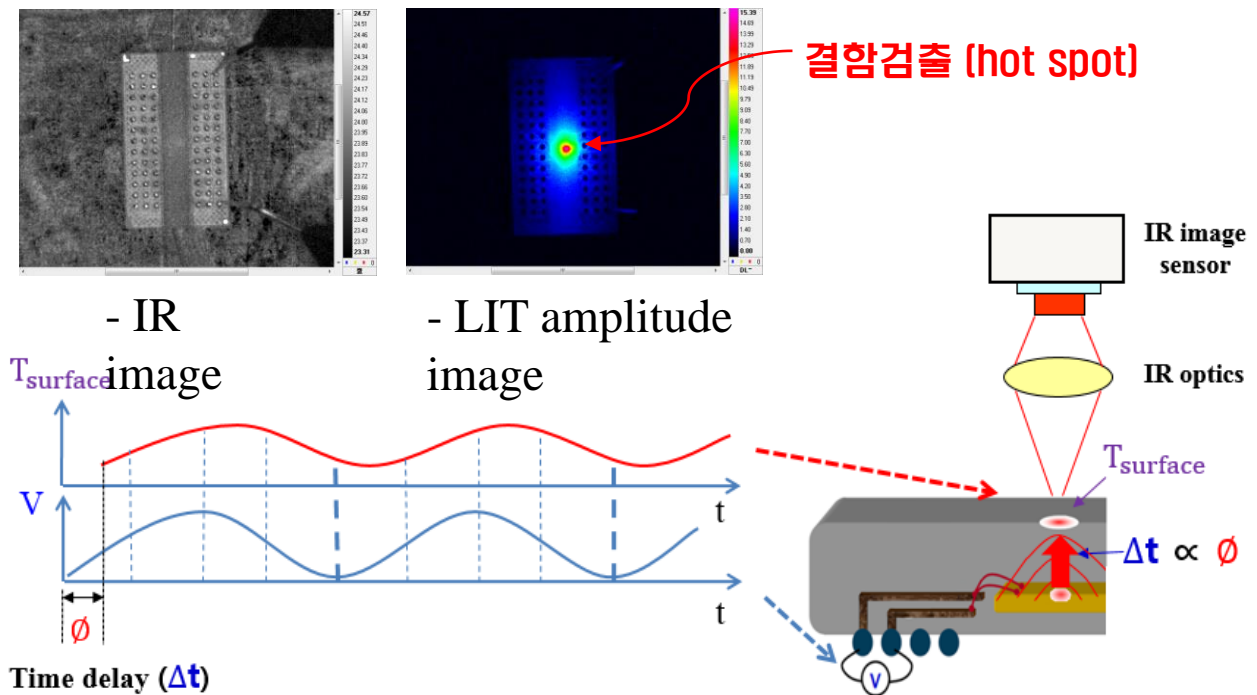


3차원 반도체 불량 검사를 위한 고해상도 적외선 광학 모듈 및 시스템

기술 개요

- 내부결함의 검출 및 열 특성을 평가하는 비파괴 열영상 검사기법
- 시료에 주기적인 에너지(V)를 인가하여 발생하는 열을 시료 표면에서 온도 진폭 및 위상이미지로 측정

세부 기술내용



지식재산권

구분	상태	등록일자	등록번호	발명의 명칭
특허	등록	2016.03.14	10-1660586	적외선 렌즈 광학계
특허	등록	2014.02.03	10-1360193	회전 연동 구조를 구비한 광학계 렌즈 리테이너 조립용 원형 차공구
특허	등록	2017.05.24	10-1741958	적정파형 및 전압 출력을 위한 반도체 검사장비 및 그 제어방법
특허	등록	2017.07.14	10-1759862	위상잠금 열화상기법을 이용한 열물성 측정 방법
특허	출원	(미공개)	(미공개)	레이저 위상잠금 열화상기법을 이용한 열확산율 측정장치